

中央光学出版株式会社

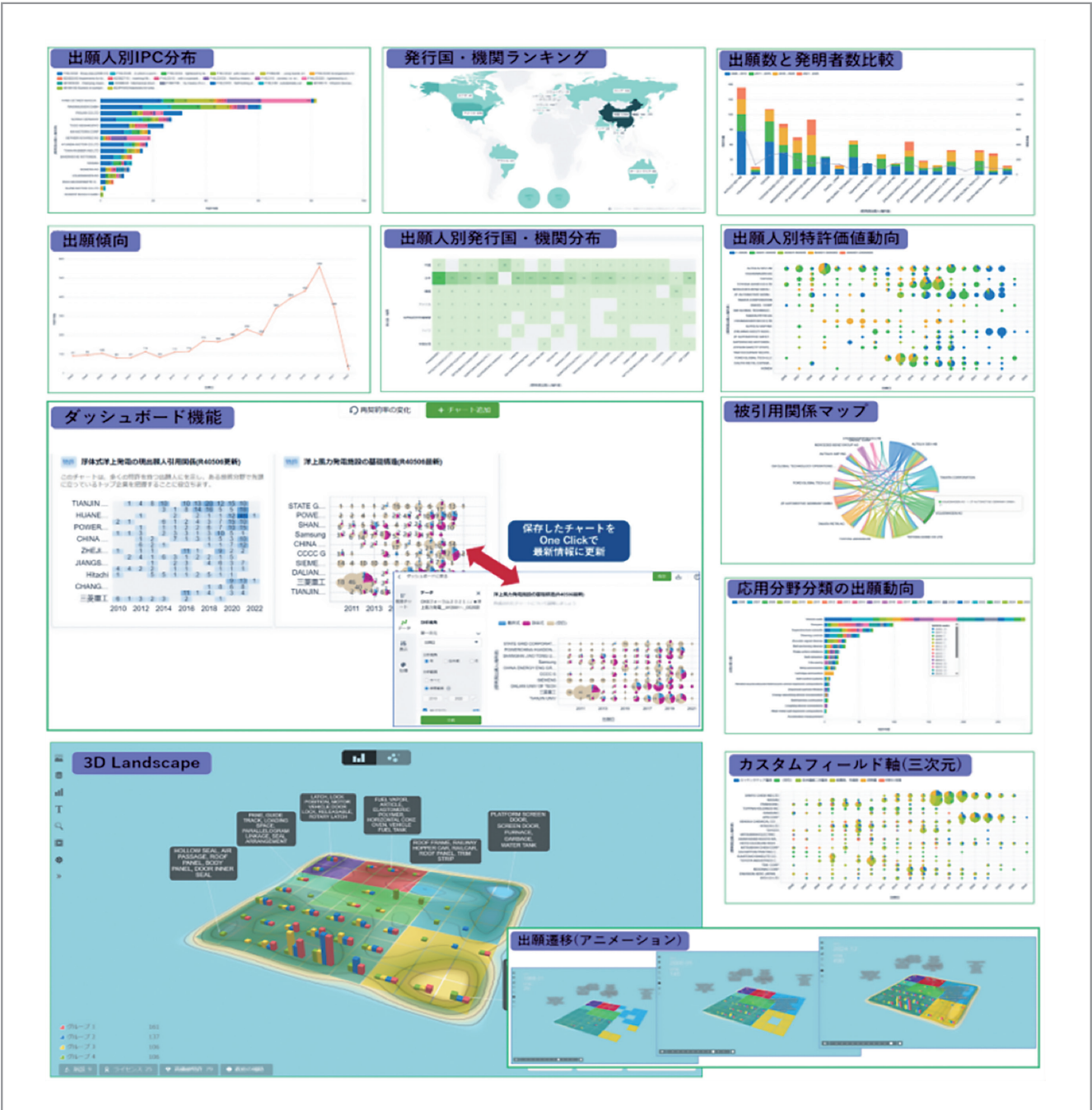
PatSnap Analytics

本社住所	〒136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8 亀戸トーセイビルⅡ 3F
URL	https://www.cks.co.jp/
問い合わせ先	担当部署 営業部 T E L 03-6721-5561 F A X 03-6721-5565 E-mail tokyo-sales@cks.co.jp

世界各国の特許／意匠が収録された PatSnap Analytics 検索結果の母集団を簡単な操作でシームレスに統計および分析ができます。事前のデータダウンロードが不要で分析結果から公報データ閲覧もスムーズに行えます。分析結果は EXCEL やイメージデータとして出力することが可能でダッシュボード機能を利用して保存したチャートの整理を行行情報共有もできます。3D Landscape マップを搭載し多数の特許をより効果的に把握することができます。

機能詳細

データ	解析対象	日本／米国／欧州／PCT／中国／韓国／独国／仏国／台湾／露国／オーストラリア／オーストラリア／カナダ／スイス／スペイン／フィ ンランド／イギリス／香港／インド／マカオ／ノルウェー／ニュージーランド／スウェーデン／シンガポール／タイ他 170カ国以上								
	入力方法	PatSnap								
	処理可能最大案件数	上限無し	特徴	PatSnap 検索結果の母集団からシームレスに解析、3D Landscape マップは最大 5 万件						
データの編集機能	検索（絞込み）機能	可	特徴							
	データの追加・修正・削除	可	特徴	出願人グルーピング機能						
	その他の編集機能	可	特徴							
解析項目	解析可能項目と上限値	出願人	解析可	上限	有	上限値	0	備考		
		発明者	解析可	上限	有	上限値	0	備考		
		IPC	解析可	上限	無	上限値	0	備考		
		FI	解析可	上限	無	上限値	0	備考		
		CPC	解析可	上限	無	上限値	0	備考		
		技術用語	解析可	上限	無	上限値	0	備考		
		その他項目・項目の任意追加		日付、リーガルステータスなど						
		特許文献・参考文献サポート		有	特徴	チャートからシームレスに特許ファミリーを閲覧可能				
引用文献サポート		有	特徴	引用関係図						
特許価値評価機能		有	特徴							
AI 活用サービス		無	特徴							
帳票出力	市販ソフトの作図機能	利用可	特徴	png 形式、Excel、PDF、Word						
	独自の作図機能の特徴	カスタムフィールドを活用して様々な分析が可能								
データ出力	CSV 出力	可	特徴							
	解析結果データの互換性	有	特徴	EXCEL 出力						
	用語切り出し&索引化機能	有	特徴							
その他の機能										
他のシステムとの連携	検索・DB システム	可	種類	PatSnap Analytics 検索モジュールと連携可能						
		その他・特記事項等								
	分析ツール	可	種類	PatSnap Analytics レポート機能						
その他・特記事項等										



導入用情報

動作環境	OS	Microsoft Windows 11
	その他	Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge
	関連ソフト	
サポート体制		ヘルプデスク／マニュアル類／講習会
費用	導入費	年間契約
	ランニングコスト	
	その他	
その他・特記事項等		

中央光学出版株式会社

PatSnap Analytics レポート 機能

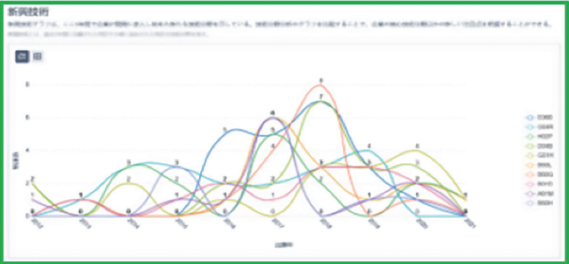
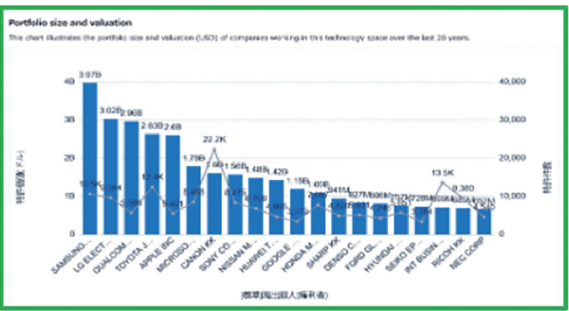
本社住所	〒 136-0071 東京都江東区亀戸 6-1-8 亀戸トーセイビルⅡ 3F		
	URL https://www.cks.co.jp/		
問 い 合せ先	担当部署 営業部		
	T E L 03-6721-5561		
	F A X 03-6721-5565		
	E-mail tokyo-sales@cks.co.jp		

PatSnap Analytics レポートは、R&D、IP および事業・開発戦略のリーダーにビジネスインテリジェンスを提供し、最も効果的な IP 戦略を実現します。このツールにより組織は機会と脅威を評価して技術動向を追跡し、重要特許を見つけ競争状況を分析することが可能となり組織全体がイノベーション情報に基づいて目的に到達できるよう支援します。

簡単な操作で、技術、企業、訴訟、特許維持、特許出願、投資買収、研究開発戦略の各種レポートを自動作成することができて多角的な視点で市場分析することが可能です。

機能詳細

データ	解析対象	日本／米国／欧州／PCT／中国／韓国／独国／仏国／台湾／露国／オーストラリア／オーストラリア／カナダ／スイス／スペイン／フィンランド／イギリス／香港／インド／マカオ／ノルウェー／ニュージーランド／スウェーデン／シンガポール／タイ他 170カ国以上							
	入力方法	PatSnap							
	処理可能最大案件数	上限無し	特徴						
データの編集機能	検索（絞込み）機能	可	特徴						
	データの追加・修正・削除	可	特徴	出願人グルーピング機能					
	その他の編集機能	不可	特徴						
解析項目	解析可能項目と上限値	出願人	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		発明者	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		IPC	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		FI	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		CPC	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		技術用語	解析可	上限	無	上限値	0	備考	
		その他項目・項目の任意追加	ワークスペース内で定義されたカスタムフィールドも解析可						
特許文献・参考文献サポート		有	特徴	PatSnap Analytics で特許ファミリーを閲覧可能					
引用文献サポート		有	特徴	被引用特許情報を利用して評価					
特許価値評価機能		有	特徴	目的別にレポートの作成が可能					
AI 活用サービス		有	特徴	技術タイムラインで AI 利用					
帳票出力	市販ソフトの作図機能	利用可	特徴	PDF、PowerPoint、Excel、Word					
	独自の作図機能の特徴	企業レポート、競合レポート、技術レポートを短時間で作成							
データ出力	CSV 出力	可	特徴	PatSnap Analytics で特許ファミリーを閲覧可能					
	解析結果データの互換性	有	特徴	レポート共有					
	用語切り出し&索引化機能	有	特徴						
その他の機能		特許価値、訴訟リスク、訴訟歴、合併シミュレーション、特許維持、ライセンス探索、訴訟分析（米国・中国）、中国特許事務所分析、米国審査官分析、Art Unit 予測、競合分析、技術タイムライン							
他との連携	検索・DB システム	可	種類	PatSnap Analytics 検索モジュールと連携可能					
		その他・特記事項等							
	分析ツール	可	種類	PatSnap Analytics					
		その他・特記事項等							



導入用情報

動作環境	OS	Microsoft Windows11
	その他	Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge
	関連ソフト	
サポート体制		ヘルプデスク／マニュアル類／講習会
費用	導入費	年間契約
	ランニングコスト	
	その他	
その他・特記事項等		